

# Silicio – ( $\text{SiO}_2$ )

Parámetros Analíticos de $\text{SiO}_2$		
Muestras incluidas en el análisis por técnica analítica	Técnica	Número
	EE	0
	AAS	0
	ICP-AES	0
	XRF	21.183
	<b>TOTAL</b>	<b>21.183</b>
Muestras excluidas por técnica analítica	Técnica	Número
	EE	813
	AAS	1603
	ICP-AES	4
	XRF	153
	<b>TOTAL</b>	<b>2573</b>
Límite de detección utilizado	Valor	Número de datos reducidos
	No Aplica	0

Estadísticas Básicas	
Total Registros	21.183
Mínimo	13,38
30%	61,61
60%	71,68
80%	85,12
90%	95,04
95%	97,87
98%	98,64
Máximo	99,90
Mediana	67,70
Desviación Absoluta de la Mediana	9,41
Promedio	70,59
Desviación Estándar	14,84

Figura No 44. Tablas de parámetros analíticos y estadísticos de Silicio.

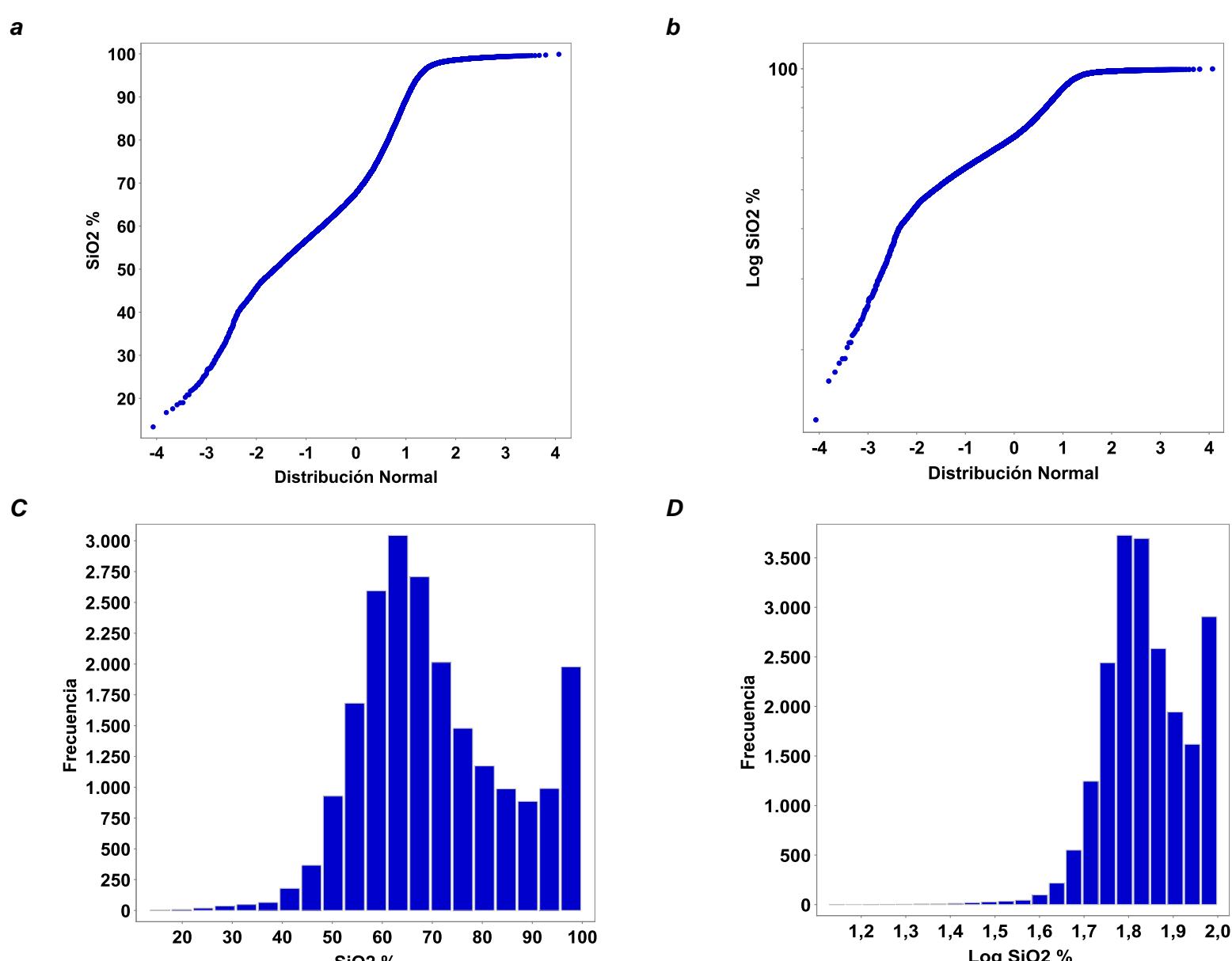


Figura No 44. **a)** Variación de la concentración en sedimentos de Silicio en % con la distribución acumulativa empírica (normal). **b)** Variación de la concentración de Silicio en % en sedimentos (escala logarítmica) con la distribución acumulativa empírica (normal). **c)** Histograma  $\text{SiO}_2$  (normal). **d)** Histograma  $\text{SiO}_2$  (logarítmica).

